

Sav 8000+

Le test digital fonctionnel



Le **Sav 8000+** est le nouveau venu de la famille des systèmes 8000, il succède au SAV8000 pour répondre aux nouvelles exigences de l'électronique, il est destiné à tous ceux qui réparent des cartes électroniques digitales et/ou analogiques de faibles puissances en maintenance ou en fabrication de petites séries.

FONCTIONS



Testeur fonctionnel manuel des composants (sur et hors carte) pour toutes les familles numériques type **TTL, CMOS, LVTTTL, ECL, DTL, RTL, PECL, LVPECL**, mémoires, interfaces, LSI, micro-processeurs, analogiques, ou hybrides, en test fonctionnel (table de vérité), mesure des connexions, des tensions, des niveaux logiques, de la température interne du composant, analyse de signature V/I.

Cette fonction affiche graphiquement tous les chronogrammes des tests digitaux appliqués sur les entrées, ceux relevés sur les sorties ainsi que toutes les différences en mode comparaison logicielle.

Les tables de vérité des composants numériques sont stockées dans une bibliothèque. Il suffit d'appeler le nom du composant à tester, de cliquer celui-ci, de lancer la fonction «TEST» et le **Sav 8000+** indiquera si le composant est **BON** ou **DÉFECTUEUX**.



Générateur graphique de test (avec apprentissage automatique) pour test fonctionnel GO/NO GO et comparaison automatique. Permet de tester tout type de composants numériques par stimulation des entrées et auto apprentissage des sorties.



Grâce au **Checker de carte**, vous pouvez faire du test complet de carte, chaque sortie du SAV8000+ peut être forcée en écriture ou lecture de tension, mais aussi en analyse V/I.



Identificateur (sur et hors carte) des composants digitaux codés ou effacés. Cette fonction indique la référence, la fonction et les équivalents du composant sous test.



Détecteur et localisateur très précis des courts-circuits et coupures (résolution 1 à 3 mm). Fonctions de recherche de connexions (avec indication sonore) et ohmmètre.

SPÉCIFICATIONS

64 broches d'E/S extensibles à 2048 :

- Nombre de gardes (sorties : 8 par module
- tension de sortie : +/- 10 volts
- courant de sortie : 600 mA
- Compatibilité : Selon norme DEF 00-53 (standard décence)
- slew rate : > 100 V/μs
- tension d'entrée : +/- 20 V
- Résolution d'entrée : 10mV
- impédance d'entrée : 10 kΩ
- états : Programmable
- Terminaison des canaux : programmables, trois états, pull up, pull down, bi-directionnel

Nombre de vecteurs de test : illimité

Mode de test : unique, cyclique, cyclique BON, cyclique DEF

Types de test :

- fonctionnel (table de vérité)
- connexions : court-circuit au 0 V ou au Vcc, circuit ouvert ou flottant, lien entre broches, charge au 0 V ou au Vcc, signal, etc.
- tensions : détection des états logiques avec seuils programmables
- thermique : indication liée à la température interne au CI
- V/I :
 - gamme de tension : ajustable entre -10 V à +10 V
 - courant maximum : 1 mA
 - affichage V/I : par groupe de 8
 - fonction zoom
 - superposition des courbes V/I et calcul du recouvrement en mode comparaison

1 alimentation :

- 5V / 5A
- protection contre les surtensions : au-delà de 7 V
- protection contre les courts-circuits : I_{max} = 7 A

Librairies :

- Toutes les familles logiques, TTL, CMOS, LVTTTL, ECL, DTL, LSI, RTL, PECL, LVPECL, Memory, Microprocessor
- Type de boîtiers : DIL, SOIC, PLCC, QFP

Document non contractuel. Les caractéristiques des produits, logiciels et services sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis.

Deltest

ZI Toul Europe, Secteur B 54200 TOUL France
Tél. : (33) 3 83 43 85 75 Mail : deltest@deltest.com

www.deltest.com